

Statistical Process Control (SPC Workshop for Supervisor) รุ่นที่ 91

วันที่จัด วันอังคารที่ 24 - วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561

เวลา 09.00 - 16.30 น. (ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.) รับจำนวน 20 ท่าน

สถานที่ ณ ห้องสัมมนา สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ซอยพัฒนาการ 18

สมาชิก 7,500 + VAT 7% 525 = 8,025 บาท

(สมาชิก ส.ส.ท., นักศึกษาปริญญาตรี, หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ)

บุคคลทั่วไป 8,000 + VAT 7% 560 = 8,560 บาท



ระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO 9000 หรือ IATF 16949 ข้อกำหนดหนึ่งในมาตรฐาน ก็คือการใช้สถิติเพื่อควบคุมกระบวนการ (Statistical Process Control) ถือเป็นส่วนที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่เท่าที่ผ่านมาการใช้เครื่องมือชนิดนี้ยังไม่แพร่หลายเท่าที่ควร อาจจะเป็นเพราะปัญหาบางประการของการทำความเข้าใจกับเรื่องสถิติแนวทางการประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติ

วิธีการประยุกต์ใช้แผนภูมิควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนวิธีการแปลความหมายของข้อมูลที่เกิดขึ้นในแผนภูมิ และการประเมินความสามารถของกระบวนการ ด้วยดัชนีวัดความสามารถของกระบวนการ Cp, Cpk ท่านสามารถหาคำตอบได้จากหลักสูตรนี้ **หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้พื้นฐานด้าน SPC**

สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. การสร้าง และแปลความหมายแผนภูมิควบคุม
2. การวิเคราะห์ และควบคุมคุณภาพ
3. การประเมินความสามารถของกระบวนการ ทั้งข้อมูลเชิงผันแปร และข้อมูลเชิงคุณภาพ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมและสัมมนา

ผู้ประสานงานคุณภาพ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพ Foreman Supervisor และผู้สนใจทั่วไปที่ไม่มีความรู้พื้นฐาน SPC มาก่อนก็สามารถเข้าได้

วิทยากร

1. **ผศ.เจริญ สุนทรวานิชย์**
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. **ผศ.วิศิษฐ์ ไส้เจริญรัตน์**
วิทยากรที่ปรึกษา/ที่ปรึกษาวิชาการ
ประธานกรรมการตัดสินผลงาน Thailand Kaizen Award ส.ส.ท.

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

วันแรก

- แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ
- แนวคิดและหลักการในการควบคุมคุณภาพ
- ความผันแปรของกระบวนการผลิต
- แนวคิดด้านสถิติเบื้องต้นเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล
- เครื่องมือสถิติในการควบคุมกระบวนการ
- แผนภาพการกระจาย, ฮิสโตแกรม
- แบบฝึกหัดสำหรับฮิสโตแกรม

วันที่สอง

- หลักการของแผนภูมิควบคุมและเครื่องมือแสดงสถานะที่เปลี่ยนแปลงของกระบวนการ
- แผนภูมิควบคุมเชิงผันแปร (Variable Control Charts) : ข้อมูลวัด
- วิธีการสร้าง
- แผนภูมิควบคุม Xbar-R, Xbar-S และ X-MR
- การศึกษาความสามารถของกระบวนการสำหรับข้อมูลเชิงผันแปร
- กรณีศึกษา

วันที่สาม

- แผนภูมิควบคุมเชิงคุณภาพ (Attribute Control Charts) : ข้อมูลนับ
- แผนภูมิควบคุม p, np, c, และ u
- กรณีศึกษา
- การตีความหมายในแผนควบคุม
- ความสัมพันธ์ระหว่าง SPC, กระบวนการแก้ไขปัญหา

